

2022年度版

膜厚測定・表面形状測定

フィルメトリクス株式会社

膜厚測定システム

世界中で 5000 台以上使用されているベーシックモデル！

F20

FILMETRICS
A KLA Company



F20

- ・ 膜厚測定範囲 15nm ~ 70 μ m
- ・ 測定波長領域 380 - 1050nm

F20 本体、測定ステージ、
制御パソコン、膜厚サンプル 他

F20-UV

- ・ 膜厚測定範囲 1nm ~ 40 μ m
- ・ 測定波長領域 190 - 1100nm

F20 本体、UV 光源、測定ステージ、
制御パソコン、膜厚サンプル他

数量限定！
納期2ヶ月！！

共通仕様

御見積・御購入の前に、測定の可否、装置仕様のご確認をお願いいたします。

- ① F20 : 膜厚の $\pm 0.2\%$ 、もしくは 2nm いずれか大きい値
F20-UV : 膜厚の $\pm 0.2\%$ 、もしくは 1nm いずれか大きい値

(注) 当社が提供する Si 基板上の SiO₂ 膜を測定した場合の機器本体の正確性

- ② 取り扱い説明は現地またはオンラインで実施

FILMETRICS
A KLA Company

フィルメトリクス株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-5-9 新横浜フジカビル8F Tel: 045-473-7109
Email: info@filmetrics.co.jp URL: www.filmetrics.co.jp

3次元表面形状測定システム

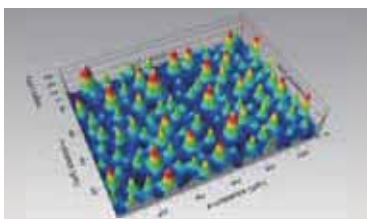
Profilm3D

表面形状・段差・粗さ測定システムを身近に！

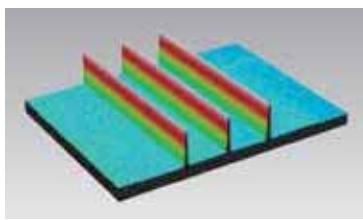
FILMETRICS
A KLA Company

1台でナノオーダーの表面粗さ測定からミリオーダーの形状段差測定まで可能です。

段差測定範囲	～ 10 mm
段差測定正確性	0.7%
XY分解能	最小 0.4μm
測定ステージ	100×100mm 200×200mm



ポリマー混合物の3次元形状



導波路型回折格子

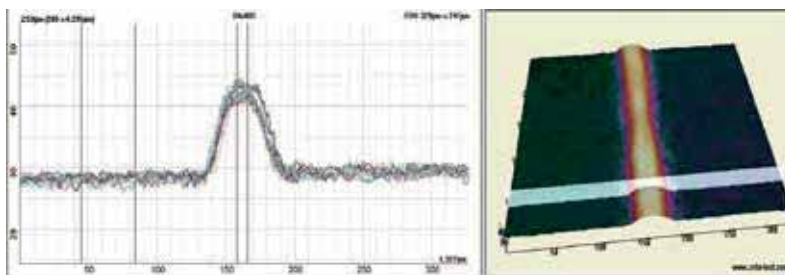
マルチ共焦点顕微鏡システム

Zeta-20

独自の ZDot™ テクノロジーで高速測定！

KLA
INSTRUMENTS

非接触で段差・粗さ・寸法の測定結果を True Color 画像で表示します。デュアル光源を搭載し、高反射率部と低反射率部を同時に測定できます。



太陽電池サンプル 反射率が95%の銀電極部と1%以下の黒いセル部を同時に測定

オンラインでサンプル測定やデモを実施していますので、お気軽にお問い合わせ下さい

フィルメトリクス株式会社

資料請求等のお問合せ先は

メール : info@filmmetrics.co.jp